# Усиление угловой дисперсии лазерных гармоник высокого порядка при взаимодействии с плотными плазменными кластерами

Л.А. Литвинов $^{1}$ , А.А. Андреев $^{1,2}$ 

 $^{1}$ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург  $^{2}$ Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург

- 1 Введение
- 2 Базовая модель
- 3 Одиночный кластер
- 4 Множество кластеров

В рамках теории рассеяния Ми было рассмотрено множество кластеров в виде протяженного газового слоя с регулярной и квазирегулярной пространственной конфигурацией для исследования возможности рассеяния такими структурами на большие углы жёсткого ультрафиолетового излучения, в частности соответствующего гармоникам высокого порядка.

В качестве регулярного распределения была выбрана примитивная кубическая решетка с расстоянием между соседними кластерами  $d=2\lambda_{10}$ , одинаковым во всех направлениях декартовой системы координат. Квазирегулярное распределение было построено при помощи внесения случайных сдвигов координат центров кластеров относительно регулярного расположения со случайной нормой сдвига в диапазоне  $0 \le |\Delta d| \le 0.43d$ . Таким образом расстояние между соседними кластерами имеет диапазон  $0.28\lambda_{10} \le d \le 3.72\lambda_{10}$ .

В квазирегулярном случае моделирование было проведено несколько раз с целью усреднения и получения обобщенной картины рассеянного поля. Для вычислений был использован программный код CELES [1].

#### 4.1 Резонансное рассеяние лазерной гармоники

Условие Брэгга-Вульфа [2] в случае регулярной решетки:

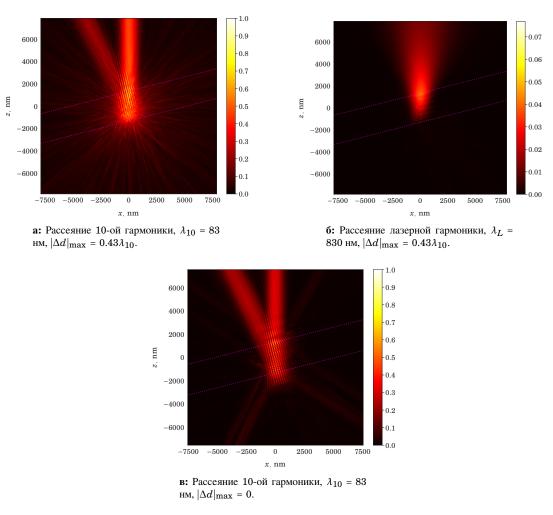
$$2d\sin(\theta+\varphi) = 4\lambda_{10}\sin(\theta+\varphi) = n\lambda, \qquad n = \frac{4\lambda_{10}}{\lambda}\sin(\theta+\varphi), \tag{1}$$

где  $\theta$  — угол между направлением падающего излучения и нормалью к поверхности структуры,  $\varphi$  — угол между нормалью к поверхности и вектором решетки структуры. Для квазирегулярного распределения в слое вместо точного d использовано усредненное расстояние между кластерами, которое за счет использования равномерного распределения (выр. 3) в построении сдвигов будет примерно равно d.

Поиском по сетке был найден угол  $\theta$  =  $14.324^\circ$ , соответствующий наиболее интенсивному рассеянию в направлении минус первого дифракционного максимума при d =  $2\lambda_{10}$ . При этом угол  $\varphi$  был взят нулевым для простоты.

Рассеянные поля, полученные при моделировании, представлены на рис. 1. В этом случае мишень более реалистична, так как состоит из материала с реалистичной электронной плотностью  $n_{el}=5.7\cdot 10^{23}\,{\rm cm}^{-3}\approx 4.4n_c$  для  $\lambda_{10}=83$  нм. В качестве падающего поля был использован гауссов пучок с той же интенсивностью, что и в случае с одиночным кластером  $I_L\approx 10^{18}\,{\rm Bt/cm}^2,~I_{10}\approx 10^{14}\,{\rm Bt/cm}^2,~$  параметром ширины  $w=1700\,$  нм, направленный вдоль оси z и поляризованный вдоль оси x.

На 1а, 16 видна значительная разница между резонансным и нерезонансным случаем — рассеяное поле 10-ой гармоники четко ограничено, хорошо видно рассеяние в двух направлениях, соответствующих минус первому и первому порядкам дифракции (выр. 1), амплитуда поля превышает таковую в отсутствии резонанса более, чем в 10 раз, что соответствует условию Брэгга-Вульфа при найденном угле.



**Рис. 1:** Рассеяние гауссового пучка ширины w=1700 нм на слое квазирегулярно расположенных кластеров размера ka=0.7 ( $a\approx8.9$  нм). Угол падения  $\theta=14.324^\circ$ . Границы газового слоя обозначены пурпурным цветом. Амплитуда  $|\mathbf{E}_8|$  построена в плоскости поляризации падающей волны, нормированная на максимальную амплитуду в случае рассеяния 10 гармоники.

#### 4.2 Учет квазимонохроматичности падающего поля

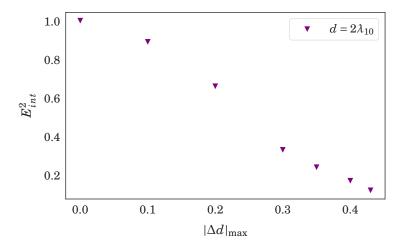
Гармоническое излучение состоит из множества частот с хорошо определенными фазами, зависящими от природы излучающей среды. Для каждой гармоники условия рассеяния разные, так как нормированные величины определяют картину рассеянного поля. Была получена обобщенная картина рассеяного поля в случае волнового пакета, включающего в себя гармоники с 8 по 12.

рисунок

#### 4.3 Направленная энергия в зависимости от нерегулярности расположения кластеров

Для того, чтобы определить, как нерегулярность расположения кластеров в слое влияет на количество излучения, отклоненного от направления падения, было смоделировано рассеяние на множествах кластеров с различными диапазонами нормы сдвига  $|\Delta d|$  в соответствии с выр. 3. Для получения энергетической характеристики, квадрат рассеянного поля был проинтегрирован на прямоугольной области с шириной, соответствующей ширине падающего пучка, вне газового слоя в направлении минус первого дифракционного максимума, отличающегося направления падающего пучка.

Интегрирование было проведено при помощи подсчета интегральных сумм с единичным шагом, то есть суммированием значений в области интегрирования. Полученный результат был нормирован на соответствующую интегральную характеристику в случае регулярной структуры расположения кластеров (рис. 1в).



**Рис. 2:** Зависимость нормированного интеграла квадрата рассеянного поля в плоскости поляризации от нерегулярности.  $|\Delta d|_{
m max}$  в единицах длины волны падающего излучения  $\lambda$ .

## 5 Particle-in-cell моделирование

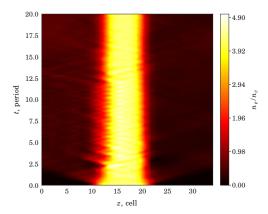
#### 5.1 Рассеяние волны одиночным кластером

В моделировании был использован одномерный код LPIC++ [3] для исследования динамики электронов и эволюции распределения плотностей в одномерном плазменном слое.

В качестве падающего поля был использован ТЕ-поляризованный лазерный импульс с длиной волны  $\lambda_{10}=83$  нм и длительностью  $\tau$ . Плазма представлена 200 частицами в каждой ячейке, занятой мишенью. При рассматриваемой длине волны импульса и электронной плотности в критических единицах  $n_{el}=4.4n_c$  толщина скин-слоя:

$$h_s = \frac{c}{\omega_{pe}} = \lambda \sqrt{\frac{n_c}{n_{el}}} \approx 40 \text{ HM}$$
 (2)

В качестве мишени взят одиночный кластер с радиусом a=50 нм. Используется равномерная сетка, в соответствии с толщиной скин-слоя  $h_s$  мишень занимает 10 ячеек, имея общую толщину 100 нм; бокс моделирования размером 33 ячейки, соответствующий расстоянию примерно четырех длин волн. Период лазерного излучения, соответствующий лазерной гармонике, равен  $T=\lambda c^{-1}\approx 2.8$  фс, поэтому длина импульса в моделировании была взята  $\tau=10T$ , время моделирования t=20T.



а: Ширина ячейки сетки 10 нм, a = 50 нм.

Видно, что в начале взаимодействия область равномерной плотности резко сужается, а сама мишень расплывается в стороны, после чего пространственное распределение электронной плотности остается практически постоянным (рис. 3a).

#### 5.2 Рассеяние волны газовым слоем

#### 5.3 Рассеяние волнового пакета газовым слоем

### Приложение

#### Случайный сдвиг кластера в пространственной решетке

Процесс вычисления сдвига для отдельного кластера описывается следующим образом:

$$P_{0} = (x_{0}, y_{0}, z_{0})$$

$$\Delta_{xyz} = (\Delta_{x}, \Delta_{y}, \Delta_{z}) = \text{rand.uniform}(-1, 1)|_{size=3}$$

$$\Delta_{xyz} = \text{rand.uniform}(0, |\Delta d|_{\text{max}}) \frac{\Delta_{xyz}}{|\Delta_{xyz}|}$$

$$P_{1} = P_{0} + \Delta_{xyz}$$
(3)

#### Резонансная электронная плотность в первом приближении

В зависимости от нормированного радиуса сферического кластера  $x = k\alpha$  и порядка сферической гармоники n:

$$m^{2}(x,n) = -\frac{8n^{2}(n+1) - 6n(x^{2}+1)}{2nx^{2}(2n-1)} \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{4n(n-3+4n^{2}(n+2))(x^{2}+4n-2)x^{2}}{8n^{2}(n+1) - 6n(x^{2}+1)}} \right]$$
(4)

$$\frac{n_e}{n_c} = (1 - m^2)(1 + i\beta_e) \tag{5}$$

## Список литературы

- [1] A. Egel, L. Pattelli, G. Mazzamuto, D. Wiersma, and U. Lemmer, "CELES: CUDA-accelerated simulation of electromagnetic scattering by large ensembles of spheres," *J Quant Spectrosc Radiat*, vol. 199C, pp. 103–110, 2017.
- [2] C. Bohren and D. R. Huffman, *Absorption and scattering of light by small particles*. Wiley Science Paperback Series, 1998.
- [3] R. E. W. Pfund, R. Lichters, and J. M. ter Vehn, "LPIC++ a parallel one-dimensional relativistic electromagnetic particle-in-cell code for simulating laser-plasma-interaction," in *AIP Conference Proceedings*, AIP, 1998.